

课程名称: ABCs of Basic IC testing

课程简介:

IC测试在整个IC产业中贯穿了从设计到wafer制造到最后封测的所有环节。本课程从IC业背景和测试基础入手,介绍了什么是测试,为什么要测试?以及怎么做测试。并且结合我们现有的测试相关的设备,让学员从实物上去感性的认识和了解测试。另一方面,也让学员了解从设计阶段的验证测试wafersort阶段的CP测试以及封测阶段的FT测试的流程,为从事相关工作的人员提供指导和帮助。

课程对象:

将要或正在从事IC测试的工程师(DesignHouse,Fab,Testing)
工作业务和IC测试有关的,对IC测试有兴趣的工程师。

收费标准:

500 RMB/人 (含讲义及午餐; 团体另有优惠)

课程安排

上课日期	上课时间	课程内容	讲师
一天	09:00-09:30	IC产业基础知识简介	资深测试工程师
	09:30-10:30	前道工程	
	10:30-10:40	休息	
	10:40-11:50	后道工程	
	11:50-13:00	午餐和休息	
	13:00-14:30	Test Outline	
	14:30-14:40	休息	
	14:40-15:10	Prober Card Introduce	
	15:10-15:20	休息	
	15:20-17:20	Technical Center参观及设备介绍,包括Tester和Prober的基本介绍和操作演示	